

Notre travail porte sur l'étude des défauts de structure par diffraction aux rayons-X, appliqué sur un montage Bragg-Brantano, pour cela plusieurs échantillons à différents teneurs en lacunes à savoir (0%, 20%, 40% et 60%) sont étudiés et simulés par le logiciel Rietveld. L'indexation des raies et l'étude de la structure cristalline se fait par des logiciels adéquats. Les résultats obtenus portent sur l'influence des défauts de structure sur l'intensité et l'élargissement des raies, le décalage des pics